

ПРОЯВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ В СПЕКТРАХ ЭПР $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20} : \text{Fe}^{3+}$

B. C. Вихнин, Л. Б. Кулева, Е. И. Леонов,

B. M. Орлов

Кристалл силиката висмута является объектом, представляющим интерес как с точки зрения его физических свойств [1, 2], так и с точки зрения приложений [3, 4]. Однако до настоящего времени свойства локальных центров в силикате висмута в значительной мере оставались неизученными. Так, не исследовалась локальная динамика точечных дефектов в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$.

В настоящей работе на основании исследований температурных зависимостей ЭПР спектра парамагнитного центра Fe^{3+} в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ показано, что локальная динамика рассматриваемого точечного дефекта Fe^{3+} связана с оптическими фононами матрицы. Анализ данных ЭПР позволил обнаружить в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ проявление колебаний оптического типа.

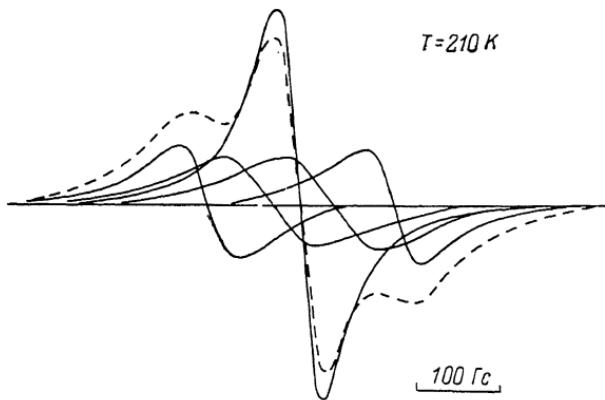


Рис. 1. Результат разложения экспериментального спектра ЭПР (штриховая линия) ионов Fe^{3+} в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ на пять компонент ТС (сплошные линии) в ориентации $\mathbf{H} \parallel [100]$.

Эксперимент по изучению ЭПР парамагнитного Fe^{3+} ($S=5/2$) в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ проводился на спектрометре ERS-231 в X -диапазоне в области температур $T=77\text{--}250$ К и на спектрометре Jeol в области температур $T=10\text{--}77$ К. Спин-гамильтониан в рассматриваемом случае имеет вид

$$\hat{H} = g^3 \bar{H} \mathbf{S} + \frac{1}{6} a \left[S_x^4 + S_y^4 + S_z^4 - \frac{1}{5} S(S+1)(3S^2 + 3S + 1) \right], \quad (1)$$

где при $T=10$ К, $g=2.004 \pm 0.004$, $a=(4.9 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$ см $^{-3}$.

С ростом температуры происходит уширение частично разрешенных линий тонкой структуры (ТС) спектра и сближение его крайних компонент, при этом g -фактор не изменяется. Для определения $a(T)$ в интервале температур $10\text{--}250$ К проводилось разложение спектра, записанного в ориентации $\varphi=0$ ($\varphi=\widehat{\mathbf{HZ}}$, $z \parallel [100]$) на пять линий ТС, форма которых полагалась лоренцевой. Такой выбор был связан с тем, что форма результирующей линии всего спектра в области максимального перекрытия отдельных линий ТС ($\varphi=30^\circ$) близка к лоренциальному. В результате разложений методом конфигураций на ЭВМ МЕРА-60 были получены значения интенсивностей, полуширины и положений компонент спектра (рис. 1). Найденная указанным способом температурная зависимость параметра расщепления кубическим полем $a(T)$ представлена на рис. 2. Видно, что в исследуемом интервале температур $a(T)$ меняется на 40 %.

Были рассмотрены два возможных механизма формирования температурной зависимости $a(T)$, позволившие достаточно хорошо (кривая на рис. 2) аппроксимировать наблюдаемую зависимость. Во-первых, изменение $a(T)$ за счет взаимодействия рассматриваемого дефекта (Fe^{3+}) с выделенным осциллятором, в качестве которого могут выступать квазилокальные (щелевые) колебания, или резонансные колебания в областях с малой плотностью состояний фононного спектра, либо оптические фононы решетки, обладающие слабой дисперсией. Во-вторых, изменение $a(T)$ за счет взаимодействия с акустическими фононами (например, в рамках модели Дебая).

В первом случае эксперимент описывается выражением [5]

$$|a(T)| - |a(0)| = C_0 \left(\coth \frac{\hbar \nu_0}{2kT} - 1 \right), \quad (2)$$

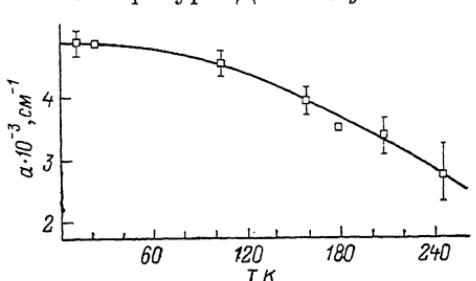
где $C'_0 = 0.18 \cdot 10^{-12} \text{ см}^{-1}$, $\hbar \nu_0 = 170 \pm 15 \text{ см}^{-1}$ — энергия фононной моды, взаимодействующей с дефектом Fe^{3+} . При использовании второго механизма [6]

$$|a(T)| - |a(0)| = C'_0 \frac{T^4}{\Theta_D^4} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (3)$$

получаем следующие значения параметров: $\Theta_D = 348 \text{ K}$, $C'_0 = -1.6 \times 10^{-2} \text{ см}^{-1}$. Так как полученное значение температуры Дебая Θ_D , заметно превосходит значение, найденное в [7] с использованием данных по упругости кристалла ($\Theta_{\text{упр}} = 250 \text{ K}$), и не может быть объяснено особенно-

Рис. 2. Температурная зависимость параметра расщепления кубическим полем.

Сплошная линия — совпадающие зависимости $a(T)$, рассчитанные по модели Эйнштейна (2) и Дебая (3).



стями реального спектра акустических фононов (которые соответствуют частотам меньшим $k\Theta_{\text{упр}}/h$), следует сделать вывод, что аппроксимация (3) не находит объяснения при разумных значениях параметров. С другой стороны, величина частоты фононной моды $\hbar \nu_0 = 170 \pm 15 \text{ см}^{-1}$, найденная из (2), близка по частоте оптического фонона Г-симметрии $\hbar \nu_1 = 172.8 \text{ см}^{-1}$ [8]. Это позволяет предположить, что рассматриваемый выделенный осциллятор обязан либо такому оптическому фонону, либо квазилокальному (резонансному) колебанию, сформированному благодаря взаимодействию дефекта с этим оптическим фононом. В обоих случаях изменение $a(T)$ будет существенно связано с колебаниями лигантов, окружающих примесный ион.

Таким образом, исследование ЭПР Fe^{3+} в $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ позволило обнаружить вклад оптических фононов матрицы в динамические свойства локального центра.

Авторы благодарны Л. С. Сочаве за полезные обсуждения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Wardzynski W., Lukasiewicz T., Zmija J. Opt. Commun., 1979, vol. 30, N 2, p. 203—205.
- [2] Grabmier B. C., Oberschmid R. Phys. St. Sol. (a), 1986, vol. 96, N 1, p. 199—210.
- [3] Петров М. П., Шлягин М. Г., Шалаевский Н. О., Петров В. М., Хоменко А. В. ЖТФ, 1985, т. 55, № 11, с. 2247—2249.
- [4] Петров М. П., Степанов С. И., Хоменко А. В. Фоточувствительные электрооптические среды в голограмии и оптической обработке информации, гл. 2, § 5. Л.: Наука, 1983.

- [5] Wardzynski W., Baran M., Szymak H. Physica, 1981, vol. 111B, N 4, p. 47—50.
[6] Müllen K. A., Berlinger W., Albers J. Phys. Rev. B, 1985, vol. 32, N 9, p. 5837—5844.
[7] Кудрин А. Ю., Волнянский М. Д., Антоненко А. М. Сб. научных трудов. «Физика активных диэлектриков», Днепропетровск: ДГУ, 1980, с. 107—119.
[8] Леонов Е. И., Семенов А. Е., Щербаков А. Г. ФТТ, 1986, т. 28, № 5, с. 1590—1592.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН ССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
11 декабря 1987 г.

УДК 538.971

Физика твердого тела, том 30, в. 5, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 5, 1988

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Tb—Co

A. С. Андреенко, Лин Жанда¹

В последние годы интенсивно исследуются физические свойства аморфных сплавов редкоземельных элементов с переходными 3d-металлами. Одной из важнейших характеристик металлических сплавов является их электронная структура, определяющая важнейшие магнитные и электрические свойства сплавов. Электронная структура большинства кристаллических соединений поддается теоретическому анализу на основе достаточно достоверных моделей. В аморфных же материалах ввиду отсутствия периодичности в структуре и статистического распределения окружения

ионов теоретический расчет сильно затруднен. В то же время в некоторых работах [1, 2] различия в таких магнитных свойствах как температура Кюри, величина магнитного момента 3d-металла и т. д. в кристаллических и аморфных материалах объясняются изменениями в электронной структуре. Поэтому большое значение имеют экспериментальные

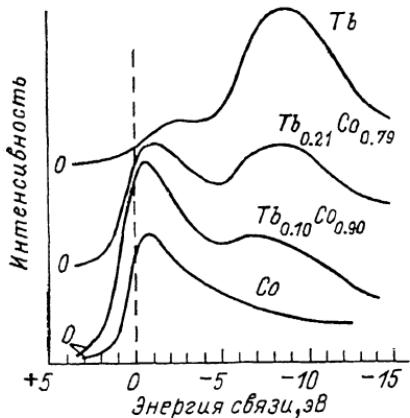


Рис. 1. Фотоэмиссионные спектры поликристаллических Tb, Co и аморфных сплавов Tb_xCo_{1-x} .

работы, в которых непосредственно исследуется электронная структура данных соединений. В настоящей работе представлены результаты исследования методом рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии (XPS) электронной структуры аморфных сплавов Tb_xCo_{1-x} в области температур 300—900 К.

Аморфные сплавы Tb—Co были получены методом ионного напыления. Методика получения аморфных пленок Tb—Co и их характеристики подробно описаны в [3].

Исследования рентгеновских фотоэмиссионных спектров были проведены в области температур 300—900 К на установке ESCA-LAB-5.

В качестве источника рентгеновских лучей использовалась мишень из Mg. Разрешение по энергиям было лучше, чем 0.8 эВ. Для очистки поверхности образцов применялась бомбардировка иона аргона.

На рис. 1 представлены XPS спектры, снятые при комнатной температуре в области зоны проводимости в аморфных сплавах Tb_xCo_{1-x} и хими-

¹ Институт физики АН КНР, Пекин.